

- 오류정정 -

학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 30(3), 9 (2023)
논문제목	“박형 기관의 사면 접합 공정 및 인장 특성 평가”
요청부분	(pp.9) 표기 누락 오류 Acknowledgement 본 연구는 2023년 인천시 반도체 후공정 소부장 산업경쟁력 강화사업의 지원을 받아 수행된 연구 결과입니다.
정정	(pp.9) 표기 누락 오류 정정 Acknowledgement 본 연구는 2023년 인천시 반도체 후공정 소부장 산업경쟁력 강화사업의 지원을 받아 수행된 연구 결과입니다. (IZ230022, UR23510)
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 30(3), 55 (2023)
논문제목	“강유전체 분극 이력곡선의 측정 정밀도 향상”
요청부분	(pp.55) 참고문헌 페이지 표기 오류 4. J. G. Lim, J. H. Park, J. Lee and S. G. Lee, “Effect of Temperature and Compressive Stress on the Dielectric and Piezoelectric Properties of PIN-PMN-PT Single Crystal”, J. Microelectron. Packag. Soc., 26(4), 63-28 (2019).
정정	(pp.55) 참고문헌 페이지 표기 오류 정정 4. J. G. Lim, J. H. Park, J. Lee and S. G. Lee, “Effect of Temperature and Compressive Stress on the Dielectric and Piezoelectric Properties of PIN-PMN-PT Single Crystal”, J. Microelectron. Packag. Soc., 26(4), 63-68 (2019).
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 30(3), 76 (2023)
논문제목	“강유전성 물질을 이용한 Multi-level FeRAM 구조 및 동작 분석”
요청부분	(pp.76) 띄어쓰기 오류 분극 현상과 정전용량의 관계, 그리고 앞선 실험 결과인 Fig. 6의 결과를 바탕으로 바라보았을 때 두 번의 Capacitance peak이 해당 전위에서의 분극 역전 현상으로 인해 기인하였음을 확인할 수 있다.
정정	(pp.76) 띄어쓰기 오류 정정 분극 현상과 정전용량의 관계, 그리고 앞선 실험 결과인 Fig. 6의 결과를 바탕으로 바라보았을 때 두 번의 Capacitance peak이 해당 전위에서의 분극 역전 현상으로 인해 기인하였음을 확인할 수 있다.